

2023年度 第15回 LSI テストセミナー

日時：2024年3月6日（水）9時～21時

場所：電気ビル共創館カンファレンス C

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 2-1-82 電気ビル共創館 3F

TEL: 0120-222-084

9時～9時10分 会場設営・受付

9時10分～9時15分 オープニング 大竹 哲史（大分大）

9時15分～9時45分

RISC-V プロセッサに対する命令レベル遷移故障テスト

○沖本明良，大竹哲史（大分大）

9時45分～10時15分

A Robust Newton-Type Iteration Method for Mixed-Cell-Height Legalization

○Chen-Can Zhou (Nantong University / Kyushu Institute of Technology), Xiaoqing Wen (Kyushu Institute of Technology)

10時15分～10時45分

Bsys3 上でのリングオシレータを用いた真の乱数生成器の評価

○吉村正義，庄田武史（京都産業大）

10時45分～11時

休憩

11時～11時30分

レジスタ転送レベルにおける識別可能ハードウェア要素ペア推定数向上のための制御信号のドントケア割当て法

○大塚 裕衣，細川 利典（日本大），吉村 正義（京都産業大），山崎 浩二（明治大）

11時30分～12時

識別不能故障グループの効率的な操作を行うデータ構造に関する一考察

○松永 裕介（九州大）

12時～12時30分

再構成可能集積回路に対する高信頼化に関する研究

○岡留志歩，大竹哲史（大分大）

12時30分～14時

休憩

14 時～14 時 30 分

加速度データに対する機械学習を用いた野球動作の行動認識に関する研究

○石津健三郎、ホルスト シュテファン、宮瀬紘平（九工大）、セングプタ ロシュウイン、ポリアン イリア（シュトゥットガルト大）、石川秀大（大分高専）

14 時 30 分～15 時

論理 BIST におけるシード数制約下でのテスト実行時間と故障検出率の評価

○曾根 隆暢，細川 利典（日本大），吉村 正義（京都産業大），新井雅之（日本大）

15 時～15 時 30 分

回路面積の増加を抑えた論理施錠手法の提案

○田中 翔也，松永 裕介（九州大）

15 時 30 分～15 時 45 分

休憩

15 時 45 分～16 時 15 分

有限状態機械の遅延故障のテストバリエーション尺度 PS2R の改良について

○吉村正義（京都産業大），豊岡雄大，細川利典（日本大）

16 時 15 分～16 時 45 分

オープンソースプロセッサ RISC-V の耐劣化設計

○長谷部健太，大竹哲史（大分大）

16 時 45 分～17 時 15 分

ウェアラブル欠陥パターン分類における画像再構成とラベリングに関する検討

山中祐輝，黒川潤，永村美一（都立大），○新井雅之（日大），福本聡（都立大）

休憩・諸連絡（17 時 15 分～18 時）

18 時～21 時

LSI テストに関する討論